

## 제18회 테스트 학술대회 일정표

시간	장소	거문고A(3층)	거문고B(3층)	거문고C(3층)	가야금A(2층)	가야금B(2층)	대금(3층)
08:30~09:00		등 록					
09:00~11:10	09:00~10:00 (60분)	<b>Tutorial 1</b> <u>"Test Strategy Implications on Cost of Test"</u> Randy Kramer(Teradyne) Chair: 유호선(삼성전자)	<b>1-1</b> Test Industry 박성주(한양대학교)	<b>2-1</b> Production Test (1) 김영부(윌테크놀로지)	<b>3-1</b> SoC Design & Test (1) 홍승일(실리콘웍스)	<b>4-1</b> ATEHardware & Software (1) 전봉완(LG전자)	<b>5-1</b> Poster 이현빈(한밭대학교)
	10:00~10:10	휴 식					
	10:10~11:10 (60분)	<b>Tutorial 2</b> <u>"High perf. DRAM Trend 및 Test 요구사항"</u> 김창일(SK하이닉스) Chair : 고진수(TERADYNE)	<b>1-2</b> Memory Test (1) 남정현(TNS)	<b>2-2</b> Production Test (2) 권민현(SK하이닉스)	<b>3-2</b> SoC Design & Test (2) 안진호(호서대학교)	<b>4-2</b> ATEHardware & Software (2) 엄경운(삼성전자)	<b>5-2</b> Test Speed Enhancement 윤홍일(연세대학교)
11:20~11:50	개 회 식 사 회 : 이 현 빈 (한밭대학교) / 개 회 사 : 강성호(연세대학교) / 감사패증정 / 우수논문시상						
11:50~12:30	초 청 강 연 강연자 : Gregory Smith (TERADYNE) "Myth vs Reality; Urban Legends of Semiconductor Test"						
12:30~13:30	점 심						
13:30~16:00	13:30~14:30 (60분)	<b>Tutorial 3</b> <u>"Live Long and Prosper -Power Semiconductor Testing"</u> 김민영(TERADYNE) Chair : 조정호(ADVANTEST)	<b>1-3</b> Memory Test (2) 조상복(울산대학교)	<b>2-3</b> Memory Test & Repair (1) 정우식(SK하이닉스)	<b>3-3</b> SoC Design & Test (3) 유홍범(삼성전자)	<b>4-3</b> ATEHardware & Software (3) 박제영(삼성전자)	<b>5-3</b> Design for Reliability (1) 김현진(단국대학교)
	14:30~14:40	휴 식					
	14:40~16:00 (80분)	<b>Tutorial 4</b> <u>"Image Sensor 테스트 방법과 불량 유형"</u> 윤준호(삼성전자) 박기수(ADVANTEST) Chair : 이중호(용인대학교)	<b>1-4</b> Memory Test (3) 권 혁(ADVANTEST)	<b>2-4</b> Memory Test & Repair (2) 김지원(태성에스엔이)	<b>3-4</b> 3D-IC Test 이창원(엑시콘)	<b>4-4</b> Test Cost Efficiency 전준우(LG전자)	<b>5-4</b> Design for Reliability (2) 백상현(한양대학교)
16:00~16:20	휴 식						
16:20~17:30	패 널 토 의 좌 장 : 김병호(한양대학교) "장비 시스템, 핸들러, 프로버, 소켓 등의 시장 상황 및 개발 동향"						
17:30~18:00	폐 회 식 폐 회 사 : 이은철(삼성전자)						